

©1994

СТРУКТУРНЫЙ ПЕРЕХОД ВЮРЦИТ-СФАЛЕРИТ В ZnS, ИНИЦИИРОВАННЫЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

*А.Х.Арсланбеков, С.С.Хасанов, В.Ш.Шехтман, М.Ш.Шихсаидов,
С.З.Шмурак*

Показано, что при ориентированной пластической деформации вюрцитная модификация ($2H$) ZnS переходит в кубическую $3C$ -структуре. Обнаружено, что этот переход осуществляется через промежуточную политипную $12R$ -фазу, которая возникает при прохождении частичных дислокаций в среднем через каждый четвертый плотноупакованный слой.

Известно, что сульфид цинка ZnS образует структуры вюрцита ($2H$), сфалерита $3C$ и большое количество политипных и микродвойниковых модификаций [1]. Механизм возникновения политипов при выращивании сульфида цинка из расплава остается невыясненным. Возможный, на наш взгляд, путь решения этой проблемы — это направленное получение политипных структур вследствие движения частичных дислокаций при ориентированной пластической деформации.

Выполненные еще в 1966 г. электронно-микроскопические исследования тонких пластинок ZnS показали, что наблюдаемые в соседних областях $2H$ и $3C$ -фазы сопрягаются частичными дислокациями, находящимися в каждом втором плотноупакованном слое [2]. О решающей роли частичных дислокаций в формировании структуры ZnS свидетельствуют работы [3–9], в которых при пластической деформации обнаружен переход метастабильных форм ZnS ($4H$, $6H$, микродвойниковых структур) в устойчивую при комнатной температуре $3C$ -структуру. Согласно представлениям, развитым и подтвержденным экспериментально в работах [3–9], этот процесс происходит в результате послойной переориентации деформируемого кристалла путем прохождения частичных дислокаций. Процессы структурной перестройки при движении частичных дислокаций рассмотрены также в работах [10, 11].

В настоящей работе проведен последовательный анализ структурных трансформаций в вюрците, протекающих при пластической деформации. Обнаружен переход $2H$ – $3C$, который осуществляется через промежуточную политипную $12R$ -структуру.

1. Методика эксперимента

Кристаллы 2Н-модификации ZnS выращивались из расплава под давлением по методу Бриджмена. В качестве стабилизирующей 2Н-структуре примеси, как и в работе [12], применялось легирование Al до 10⁻²%.

В настоящей работе проводились рентгеновские исследования и изучались спектры комбинационного рассеяния исходных и деформированных кристаллов.

Использовались образцы размером 1×1×2 mm. Они вырезались таким образом, чтобы активная при пластической деформации плоскость скольжения — базисная плоскость (0001) — располагалась под углом 45° по отношению к деформирующему напряжению (рис. 1). Пластическая деформация кристаллов ZnS осуществлялась на испытательной машине «Instron». Образцы деформировались при температуре 150°C. Скорость деформации 5 μm/min.

Для определения структурного состояния деформированных кристаллов ZnS проводились съемки рентгенограмм качания. При этом образцы ориентировались так, что ось качания совпадала с осью [0001] в гексагональной установке. Рентгенограммы качания снимались на камере РКВ-86 на рентгеновском аппарате УРС-2.0. Также проводились съемки на дифрактометре D500, при этом сканирование проводилось вдоль узлового ряда ($\bar{1}2.L$).

Спектры комбинационного рассеяния возбуждались лазером ЛГН-215 ($\lambda_{возб} = 6328 \text{ \AA}$, мощность 50 mW) и исследовались на установке «Microdil-28» при комнатной температуре и спектральной ширине щели, равной 2 cm⁻¹. Все спектры комбинационного рассеяния исследовались в геометрии рассеяния $y(x)\bar{y}(z \parallel (0001), x \parallel (1120))$. При этом каждый спектр, соответствующий определенной степени деформации образца ZnS, получен усреднением 10–15 спектров в различных точках центральной части образца (рис. 1).

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

1. Рентгеновские исследования.

Анализ рентгенограмм качания показал, что исходные недеформированные образцы имеют кристаллическую структуру 2Н без видимых признаков наличия других модификаций.

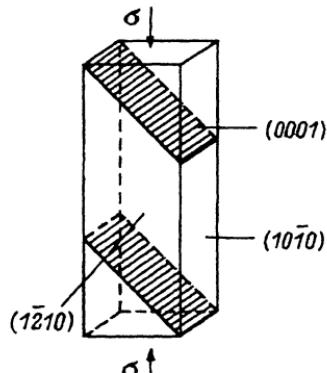


Рис. 1. Схема нагружения образца.

Область между заштрихованными плоскостями — (001) — центральная часть образца.

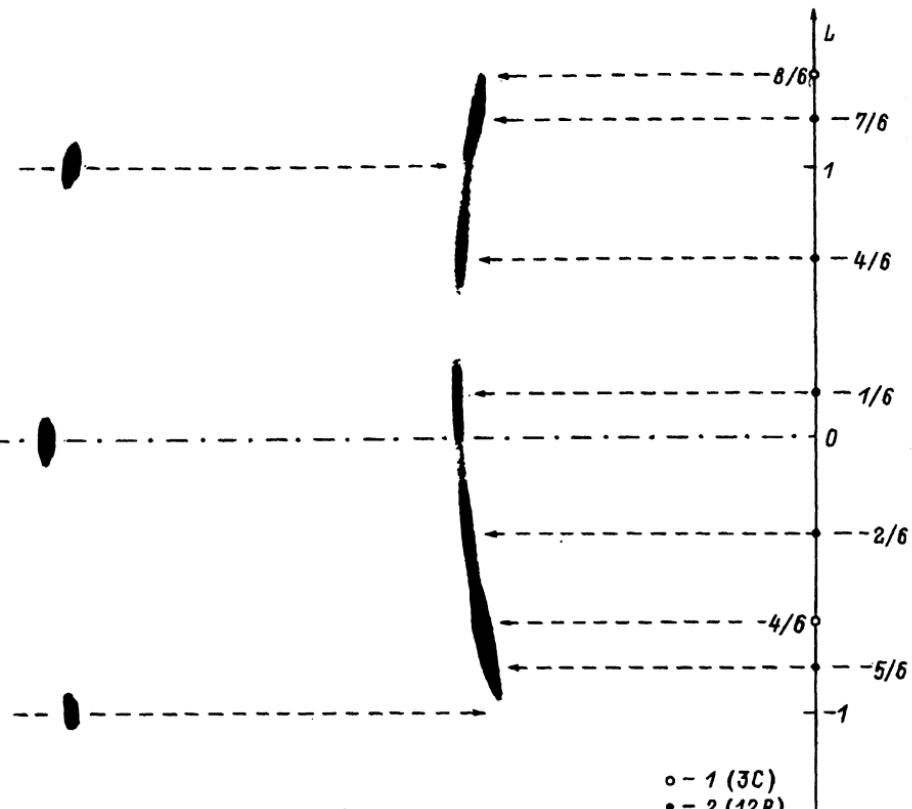


Рис. 2. Фрагменты рентгенограмм качания деформированных образцов ZnS.
 a — деформация 2%; b — деформация 10%; c — схема, поясняющая расположение группы рефлексов для деформированных образцов. Ось качания [0001]. Индексы L указаны в единицах 2Н-структуры.

Начальная стадия деформации образца (2%) характеризуется появлением на рентгенограммах слабых диффузных рефлексов (тяжей), растянутых между рефлексами исходной структуры вдоль направления [0001] (рис. 2, a). Это свидетельствует об увеличении концентрации дефектов упаковки в 2Н-структуре. При дальнейшем увеличении степени деформации (до 5%) интенсивность тяжей сильно возрастает, возникает модуляция интенсивности вдоль [0001]. Таким образом, постепенно формируются дополнительные рефлексы, свидетельствующие об образовании нового структурного состояния в образце ZnS. На рис. 2, b , с приведены фрагмент рентгенограммы качания и схема, поясняющая расположение группы рефлексов с узловым рядом ($\bar{1}2.L$) для образца, деформированного на 10%. Соответствующий участок рентгеновской дифракционной картины, полученной при сканировании узлового ряда ($\bar{1}2.L$) на дифрактометре, приведен на рис. 3.

После 10% сжатия дифракционная картина на рентгенограммах качания существенно трансформируется: во-первых, возникают дополнительные рефлексы, которые располагаются на слоевых линиях, отвечающих 6-кратному увеличению периода трансляции вдоль оси ка-

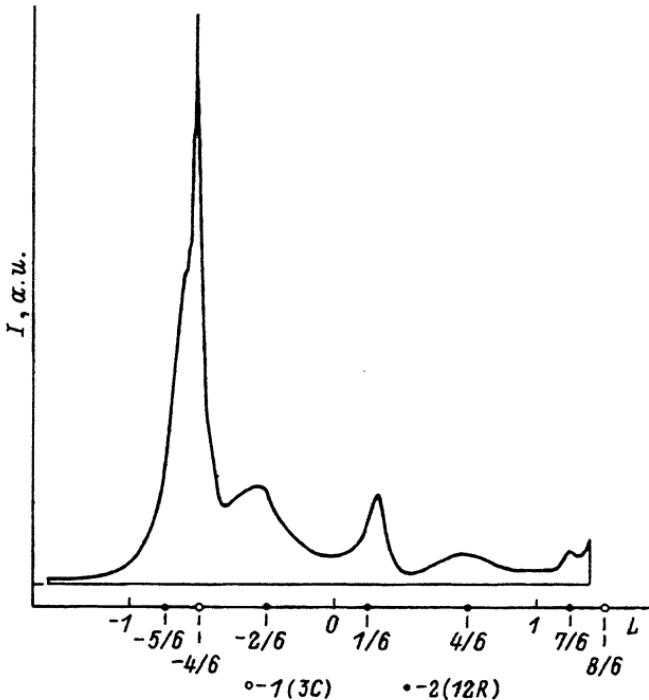


Рис. 3. Участок спектра рентгеновской дифракции вдоль узлового ряда $(\bar{1}\bar{2}, L)$ кристалла ZnS.
Деформация 10%, индексы L указаны в единицах $2H$ -структурь.

чания [0001]; во-вторых, исчезает зеркальная симметрия относительно «0»-слоевой линии рентгенограммы качания, рефлексы $2H$ -структурь уже не наблюдаются; в-третьих, можно разделить по характеру расположения и чередования интенсивностей «дополнительные» рефлексы на две группы, одна из которых расположена в 4 раза чаще вдоль [0001], чем другая. По периоду качания для рефлексов группы 1 (рис. 2, c), равному 9.6 \AA , можно установить, что они являются результатом дифракции на $3C$ -структуре, т.е. кубической модификации ZnS. Рефлексы группы 2 располагаются в 4 раза чаще, что соответствует 12-слойной структуре, а с учетом симметрии — это $12R$ -структурь. Заметим, что положения рефлексов, соответствующих $12R$ -структуре (рис. 2, b и 3), не точно совпадают с расчетными для идеальной $12R$ -структурь. Это связано скорее всего с возникновением дефектов упаковки при деформации кристалла. Тем не менее эти «неправильные» рефлексы, если рассматривать совокупность узловых рядов, располагаются строго закономерным образом, отражая симметрию ромбоэдрического кристалла, а количество наблюдаемых рефлексов между реперными рефлексами $3C$ -структурь (четыре) однозначно свидетельствует о 12-слойной структуре. Таким образом, перечисленные выше общие закономерности поведения рефлексов не оставляют сомнения в том, что в процессе деформации возникает $12R$ -структурь.

Схема структурного перехода $2H - 12R$ представлена на рис. 4. Видно, что этот переход происходит при прохождении одной частичной дислокации через каждые четыре слоя структуры. При этом осущес-

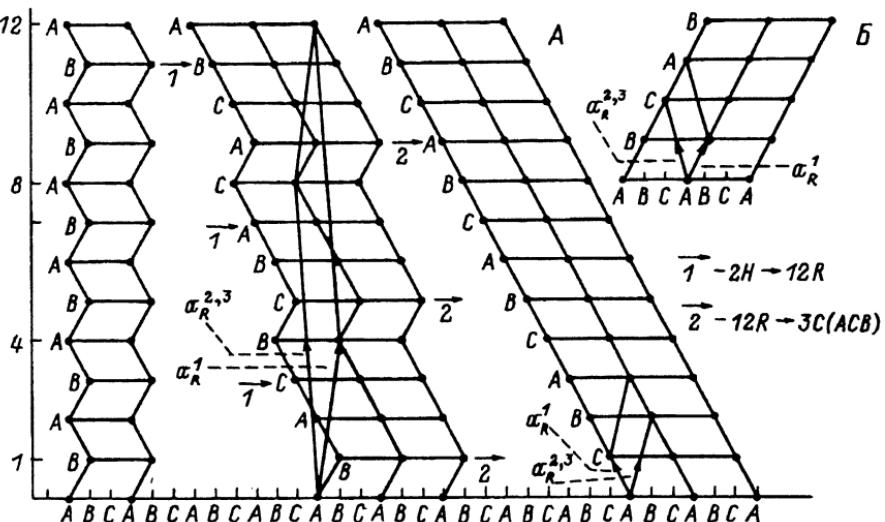


Рис. 4. Схема структурного перехода $2H\text{-ZnS}$ при пластической деформации.

Стрелками 1 и 2 указаны места прохождения частичных дислокаций для перевода $2H \rightarrow 12R$ - и $12R \rightarrow 3C$ -структур соответственно. А — вариант $3C$ -структуры, реализующийся в результате пластической деформации $12R$ -структуры, указанной на схеме; Б — вариант $3C$ -структуры с последовательностью слоев (ABC) . a_R^1 и $a_R^{2,3}$ — векторы элементарных ячеек ромбоэдрических структур.

ствляется послойная переориентация 0.25 всего объема исходного кристалла $2H\text{-ZnS}$.

Важной особенностью дифракционной картины для образца, деформированного на 10%, является несовпадение рефлексов от образовавшихся в результате пластической деформации $12R$ - и $3C$ -структур (рис. 2, б и 3). Несовпадение рефлексов означает, что здесь наложены друг на друга рефлексы от разноименных узловых рядов обратных решеток двух структур, т.е. их решетки и ромбоэдры элементарных ячеек развернуты относительно друг друга на 180° (60°). Кубическая $3C$ -модификация ZnS, возникающая при деформации $12R$ -политипа, может иметь последовательность слоев как $ACB(A)$, так и $ABC(B)$ (рис. 4). Видно, что в случае А ориентации ромбоэдров для $12R$ - и $3C$ -структур не совпадают. Именно данный вариант и реализуется в результате пластической деформации, и в этом случае рефлексы не совпадают. Для выяснения того, почему в условиях эксперимента реализуется вариант А для $3C$ -структуры с чередованием слоев ACB , а не вариант Б с чередованием слоев ABC , при котором рефлексы $12R$ - и $3C$ -структур совпали бы, рассмотрим деформационно-дислокационную модель перехода. Нетрудно показать, что для перевода $12R$ -структуры в кубическую $3C(ABC)$ -структуру (которая не реализуется в нашем эксперименте) необходимо было бы движение в среднем трех частичных дислокаций на четыре слоя структуры, т.е. в этом случае требуется послойная переориентация 0.75 объема кристалла. Напротив, для перевода $12R$ -структуры в кубическую $3C(ACB)$ -структуру необходимо прохождение в среднем одной частичной дислокации на четыре слоя. В данном случае, который и реализуется в результате эксперимента, происходит переориентация 0.25 объема кристалла (рис. 4). Следу-

ет также отметить, что в варианте A направления движения частичных дислокаций для перевода $2H$ в $12R$ и $12R$ в $3C(ACB)$ совпадают. В варианте B для перевода $2H$ в $12R$ и $12R$ в $3C(ABC)$ направления движения частичных дислокаций составляют угол $60^\circ(180^\circ)$. Это, по видимому, также затрудняет переход $12R - 3C(ABC)$, так как одно из этих направлений выделено огранкой кристалла (рис. 1). Таким образом, в результате эксперимента реализуется энергетически более выгодный вариант преобразования $12R$ - в $3C$ -структуру, возникающий в результате меньшей деформации. Значит, для перевода $2H$ -ZnS в $12R$, а затем и в $3C(ACB)$ необходимо прохождение частичных дислокаций через каждый второй плотноупакованный слой.

Сопоставление дифракционных картин образцов, деформированных на 5 и 10%, позволяет сделать следующие выводы: 1) после 5% деформации интенсивность рефлексов, соответствующих $2H$ -структуре, значительно меньше, чем для $12R$ -структуры, а в образце, деформированном на 10%, рефлексы, соответствующие $2H$ -структуре, полностью отсутствуют; 2) после 5% деформации рефлексы, соответствующие $3C$ -структуре, намного слабее, чем для $12R$ -структуры, а после 10% деформации интенсивность рефлексов, соответствующих $3C$ -структуре, значительно больше, чем для $12R$ -структуры. Это означает, что структурная перестройка $2H$ -модификации ZnS при пластической деформации вначале происходит преимущественно с образованием $12R$ -политипа, а затем $12R$ -политип переходит в $3C$ -модификацию. При этом, естественно, в реальном кристалле (и при других условиях эксперимента) может осуществляться и прямой переход $2H$ -в $3C$ -структуре.

Проведенный анализ результатов рентгеновских исследований свидетельствует о дислокационном механизме перехода $2H - 12R - 3C$. В пользу дислокационной модели наблюдаемых превращений свидетельствует также то, что этот переход практически завершается в центральной части образца при $\varepsilon = 10\%$. Это соответствует прохождению одной частичной дислокации через каждый второй плотноупакованный слой [4-9]. Так как $12R$ -политип возникает при прохождении частичных дислокаций в каждом четвертом плотноупакованном слое, можно высказать предположение, что образование $12R$ -политипа осуществляется путем коррелированного движения дислокаций в среднем к каждому четвертому слою $2H$ -ZnS.

2. Спектроскопия комбинационного рассеяния

Подробное исследование спектров комбинационного рассеяния $2H$ - и $4H$ -модификаций ZnS проведено в работе [13]. Спектры комбинационного рассеяния вюрцитной, сфалеритной и других политипных модификаций ZnS существенно отличаются. Кубическая ($3C$) и гексагональная ($2H$) модификации ZnS содержат соответственно два и четыре атома в примитивной ячейке. Это приводит к уменьшению в $2H$ -модификации в два раза зоны Бриллюэна, из-за чего дисперсионные кривые «складываются» относительно линии $k = 0.5k_{\max}$, где k_{\max} — граничный вектор зоны Бриллюэна вдоль оси C в $3C$ -структуре. Вследствие этого в спектре комбинационного рассеяния $2H$ -ZnS появляются два дополнительных фонана симметрии E_2 с частотами 67 см^{-1} (TA -ветвь сфалерита) и 283 см^{-1} (TO -ветвь сфалерита),

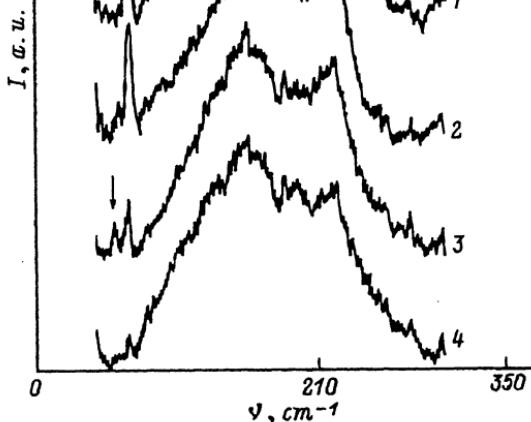


Рис. 5. Спектры комбинационного рассеяния при различных степенях деформации ϵ 2H-ZnS.

1 — исходный; 2 — $\epsilon = 2.0$, 3 — 5.5,
4 — 10.0%.

которые отсутствуют в спектре комбинационного рассеяния сфалерита.

Спектры комбинационного рассеяния политипа 12R-ZnS также должны иметь дополнительные моды по сравнению со сфалеритом. Это обусловлено тем, что примитивная ячейка структуры 12R-ZnS содержит восемь атомов и период 12R-структуры вдоль оси C в четыре раза больше, чем у 3C-структуры. Аналогично, как и в 2H-ZnS, это приводит к «складыванию» фононной зоны относительно линии $k = 0.25k_{\max}$, в результате чего становятся активными моды с $k = 0.5k_{\max}$ и $k = k_{\max}$.

На рис. 5 приведены спектры комбинационного рассеяния для исходного и деформированных образцов 2H-ZnS. Для недеформированного кристалла в соответствии с описанными выше литературными данными [13] в области 67 cm^{-1} проявляется максимум, соответствующий E_2 -моде 2H-модификации ZnS. В диапазоне $80-250 \text{ cm}^{-1}$ наблюдается широкий максимум, соответствующий спектру комбинационного рассеяния второго порядка. В настоящей работе мы не будем обсуждать изменения спектра второго порядка в зависимости от степени деформации образца. Увеличение степени деформации образца 2H-ZnS приводит к монотонному уменьшению интенсивности линии 67 cm^{-1} . При деформации $\epsilon = 10\%$ она уменьшается больше чем на порядок. Этот результат согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа, в соответствии с которым при больших степенях деформации центральная часть образца практически вся переходит в 3C-структуру.

В спектрах комбинационного рассеяния деформированных кристаллов на частоте 56 cm^{-1} возникает более слабый максимум. Его интен-

сивность вначале увеличивается при росте деформации, а затем начинает уменьшаться. Возможно, эта линия связана с модой $12R$ -ZnS ($k = 0.5k_{\max}$). Следует, однако, отметить, что примерно на той же частоте (58 cm^{-1}) имеется слабая линия излучения плазмы He-Ne лазера. Поэтому можно было бы предположить, что полоса 56 cm^{-1} связана с рассеянием линии излучения плазмы. Однако отсутствие этой полосы в исходном образце и исчезновение ее в деформированном на 10% кристалле свидетельствуют о том, что наблюдаемая при деформации 5% линия 56 cm^{-1} связана скорее всего с E -модой, обусловленной возникающей в процессе пластической деформации $12R$ -структурой ZnS.

Из-за слабой интенсивности линии комбинационного рассеяния первого порядка в области $260 - 290 \text{ cm}^{-1}$ мы не анализировали изменение этих линий при пластической деформации.

Таким образом, в настоящей работе показано, что при ориентированной пластической деформации кристаллов сульфида цинка по схеме одноосного сжатия реализуется структурный переход вюрцит-фалерит. Этот структурный переход осуществляется при прохождении частичных дислокаций через каждый второй плотноупакованный слой, так же как и при деформации исследованных ранее других метастабильных форм ZnS [3-9].

Обнаружено, что переход $2H - 3C$ осуществляется через промежуточную ромбоэдрическую фазу $12R$, которая возникает при прохождении частичных дислокаций в каждом четвертом плотноупакованном слое $2H$ -ZnS. При этом, возможно, движение дислокаций является скоррелированным.

Заметим, что возникновение политипной структуры $12R$ в результате движения частичных дислокаций при пластической деформации $2H$ -ZnS может свидетельствовать о возможности дислокационного механизма перехода $2H$ в политипные модификации при охлаждении выращенных высокотемпературными ($T > 1024^\circ$) методиками ZnS. В этих условиях локальные механические напряжения, возникающие при охлаждении образца, могут вызывать движение частичных дислокаций, которые и переориентируют кристалл. Конечное состояние, в которое переходит $2H$ -ZnS, зависит от конкретных условий, при которых такой переход осуществляется (примесного состава, скорости охлаждения, конечной температуры). Несомненно, что для подтверждения высказанного предположения необходимо проведение дальнейших экспериментов, в первую очередь направленных на поиски условий получения других политипных структур при пластической деформации.

Авторы выражают благодарность М.П.Кулакову за предоставление кристаллов ZnS для исследований.

Список литературы

- [1] Варма А., Кришна П. Полиморфизм и политипизм в кристаллах. М., 1969. 273 с.
- [2] D'Aragoza F.S., Delavignette P., Amelinckx S. // Phys. Stat. Sol. 1966. V. 14. P. K115-K118.
- [3] Абдикамалов Б.А., Кулаков М.П., Шехтман В.Ш., Шмурак С.З. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 12. С. 3463-3466.
- [4] Абдикамалов Б.А., Бредихин С.И., Кулаков М.П., Шехтман В.Ш., Шмурак С.З. // ФТТ. 1976. Т. 18. № 9. С. 2468-2470.
- [5] Kulakov M.P., Shmurak S.Z. // Phys.Stat.Sol. (a). 1980. V. 59. P. 147-153.

- [6] Шехтман В.Ш., Шмытько И.М., Абдикамалов Б.А., Аристов В.В. // ФТТ. 1976. Т. 18. № 5. С. 1358–1361.
- [7] Гуров А.Ф., Кулаков М.П., Половов В.М., Шмурак С.З. // ФТТ. 1976. Т. 18. № 12. С. 3706–3708.
- [8] Полетаев А.В., Прокопюк Н.Ф., Шмурак С.З. // ФТТ. 1980. Т. 22. № 10. С. 1909–1912.
- [9] Омельченко С.А., Бредихин С.И., Берлов П.А., Буланый М.Ф., Шмурак С.З., Якунин А.Я. // ФТТ. 1982. Т. 24. № 10. С. 2803–2808.
- [10] Pandey D., Lele S., Krishna P. // Proc. Roy. Soc. Lond.A. 1980. V. 369. P. 451–461.
- [11] Allen C.W., Liao K.C. // Phys. Stat. Sol. (a). 1982. V. 184. P. 673–681.
- [12] Рыскин А.И., Сысоев Л.А., Хилько Г.И. // ФТТ. 1972. Т. 14. № 4. С. 911–913.
- [13] Schneider J., Kirby R.D. // Phys. Rev.B. 1972. V. 6. N 4. P. 1290–1294.

Институт физики твердого тела РАН
Черноголовка
Московская обл.

Поступило в Редакцию
25 октября 1993 г.